

电子元件检测方法，低温试验机构

产品名称	电子元件检测方法，低温试验机构
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

电子元件检测方法，低温试验机构

性能测试分分类

- 1、负载测试：通过逐步加压的方法，达到既定的性能阈值的目标，阈值的设定应该是小于等于某个值，如CPU使用率小于等于80%
- 2、压力测试：通过逐步加的方法，是的系统的某些资源达到饱和，甚至失效的状态，简单粗暴的解释就是什么条件能把系统压奔溃
- 3、并发测试：在同一时间内，多个虚拟用户同时访问同一模块，同一功能，通常的测试方法是设置集合点
- 4、容量测试：通常是指数据库层面的，目标是获取数据库的佳容量的能力，又称之为容量预估，具体测试方法为在一定的并发用户，不同的基础数据量下，官场数据库的处理能力，即获取数据库的各项性能指标
- 5、可靠性测试：又称之为稳定性测试或疲劳测试，是指系统在高压情况下，长时间的运行系统是否稳定。如CPU使用率在80%以上，7*24小时运行，系统是否稳定
- 6、异常测试：又称之为失效测试。是指系统架构方面的测试。如在负载均衡架构中，要测试宕机、节点挂掉等情况系统的反应